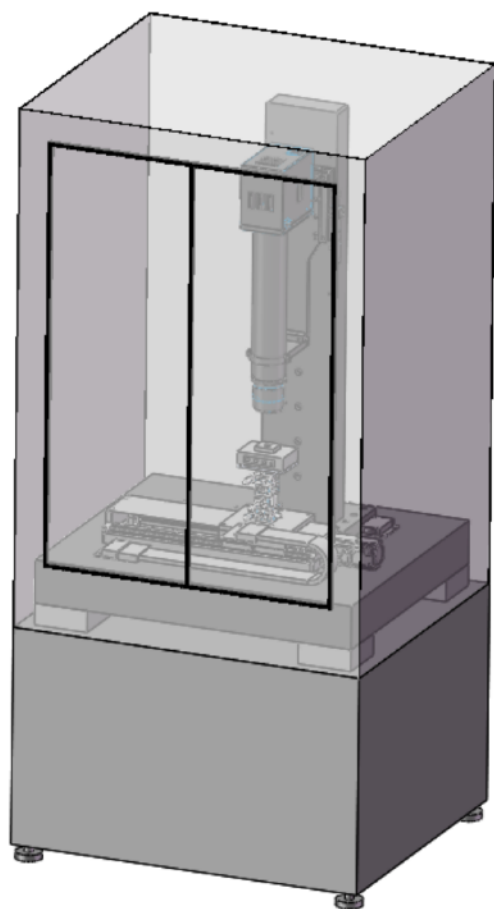


COLOR VISION Micro-LED模组校正检测机台

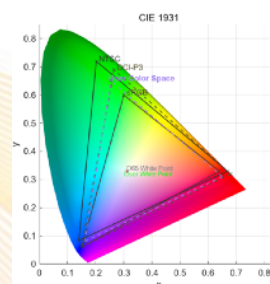
随着Micro-LED产业的发展，终端用户对于显示效果要求越来越高，视彩推出可一站式完成Micro-LED模组产品Gamma校正、Demura校正、白平衡校正和亮度光谱均匀性检测、API点亮缺陷检测的半自动设备。

该设备通过对Micro-LED 微显示屏模组进行Gamma校正和Demura校正、白平衡校正，能显著提升产品显示效果；该设备还可提供API点亮缺陷检测功能，可检测产品像素级点和线缺陷，并提供精准像素坐标供分析评价。同时，该设备提供亮度、色度、光谱、均匀性等光学测试，确定产品显示效果是否能够达到出货要求，是Micro-LED微显示企业研发、中试、生产不可或缺的设备。

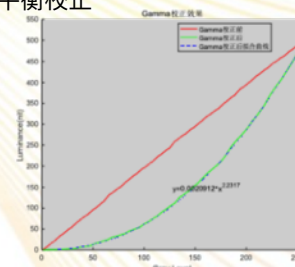
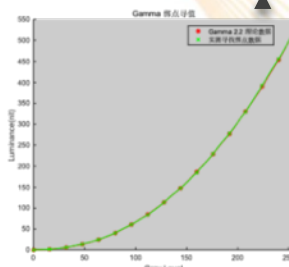
- ◇ Gamma 校正
- ◇ Demura 校正
- ◇ API点亮缺陷检测
- ◇ 亮度、色度、光谱、均匀性测量
- ◇ 支持0.12、0.26、0.39英寸等不同尺寸Micro-LED产品的测试
- ◇ 支持4um、2.5um或更小的Micro-LED像素的测量
- ◇ 支持高精度2000万、6100万、1.5亿不同像素的显微光谱成像亮度色度计
- ◇ 支持自动对焦
- ◇ 隔振平台



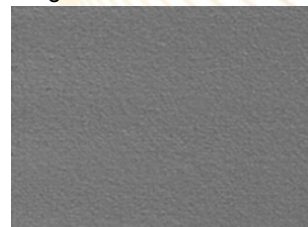
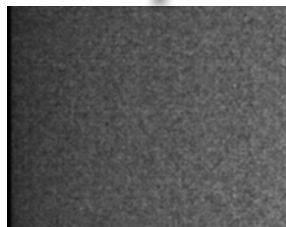
▲ 设备结构透视图



▲ 白平衡校正



▲ Gamma Tuning 效果

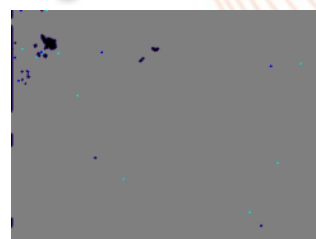


▲ Demura 前

▲ Demura 后

total defects			
index	row	col	value
1	447	539	1.891 1.4
2	442	639	2.377 5.9
3	413	496	2.367 2.8
4	345	229	2.246 7
5	312	543	2.038 1.9
6	285	638	1.930 2.4
7	174	135	2.175 3.6
8	109	930	2.354 1.4
9	95	54	2.524 2.9
10	95	57	2.293 7.8
11	88	96	2.366 3.5
12	87	63	2.228 5.2
13	79	22	2.466 1
14	0	72	2.383 5.8

▲ 缺陷检测像素坐标输出



▲ 缺陷检测图像

● 产品规格表

适用产品	
产品形态	Micro-LED 微显示模组产品
产品尺寸(inch)	0.1~0.7
产品分辨率	640x480, 1024x768等多种不同分辨率
亮度范围	0.001~1000万 cd/m ² (可定制更大量程)
像素Pitch	2.5um, 4um, 7.5um等
光电检测成像系统	
测量仪器	光谱成像亮度色度计
分辨率	5544*3684、9568x6380或 14208x10656
显微镜放大倍率	1x~6x
成像亮度测量范围	0.001~10 ⁷ cd/m ²
成像亮度测量精度	±3%
成像色度测量精度	±0.003
光谱测量范围	380nm~780nm或400~1000nm
光谱波长精度	±0.3nm
光谱色度精度	±0.002
可输出数据内容	屏幕子像素亮度数据, gamma灰阶绑点测量数据, AOI缺陷检测数据, 均匀性测量数据, CIE1931色坐标等
软件功能	
Demura 校正功能	支持
Gamma校正功能	支持
API点亮 缺陷检测功能	支持
亮度色度&均匀性检测	支持
外形尺寸&重量	
外形尺寸	720x820x1731mm
重量	500kg